
**Surface chemical analysis — X-ray
photoelectron spectroscopy —
Measurement of silicon oxide
thickness**

*Analyse chimique des surfaces — Spectroscopie de photoélectrons par
rayons X — Mesurage de l'épaisseur d'oxyde de silicium*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn